



菅沼拓夫教授らの研究グループが2013 IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2013) ・Excellent Paper Awardを受賞しました

雑誌名	SENAC : 東北大学大型計算機センター広報
巻	46
号	4
ページ	28-28
発行年	2013-10
URL	http://hdl.handle.net/10097/00124748

[報告]

林優一准教授、本間尚文准教授、水木敬明准教授、青木孝文教授、曾根秀昭教授の研究グループが 2013 IEEE EMC International Symposium on Electromagnetic Compatibility・Best Symposium Paper Award を受賞しました

サイバーサイエンスセンターの水木敬明准教授，曾根秀昭教授情報科学研究科の林優一准教授，本間尚文准教授，青木孝文教授が 2013 IEEE EMC International Symposium on Electromagnetic Compatibility において Best Symposium Paper Award を受賞しました。

受賞論文名：Map-based Analysis of IEMI Fault Injection into Cryptographic Devices

著者：林優一，本間尚文，水木敬明，青木孝文，曾根秀昭

菅沼拓夫教授らの研究グループが 2013 IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2013)・Excellent Paper Award を受賞しました

サイバーサイエンスセンターの菅沼拓夫教授，電気通信研究所の白鳥則郎客員教授，和泉諭研究員らの研究グループが，2013 IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2013)において Excellent Paper Award を受賞しました。

受賞論文名：G-MIB: Green-oriented Management Information Base and Its
Standardization in IETF

著者：Satoru Izumi, Naoki Nakamura, Hiroshi Tsunoda, Masahiro Matsuda, Kohei Ohta,
Takuo Suganuma, Glenn M. Keeni, Norio Shiratori